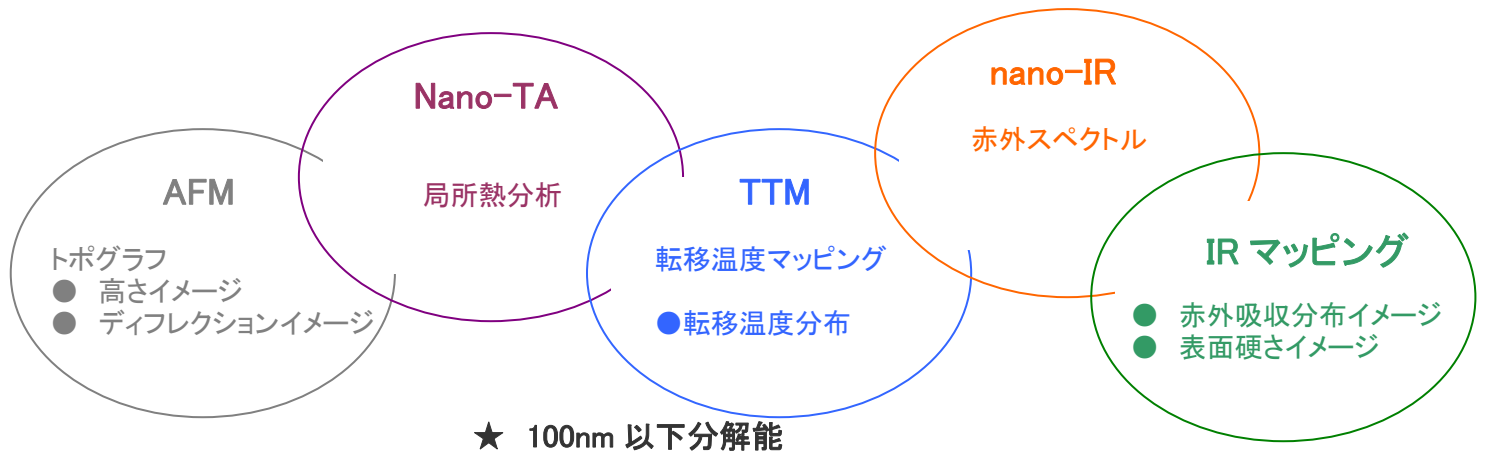


多機能局所分析装置のご案内

afm+ AFM プラス システム (VESTA-AFM)

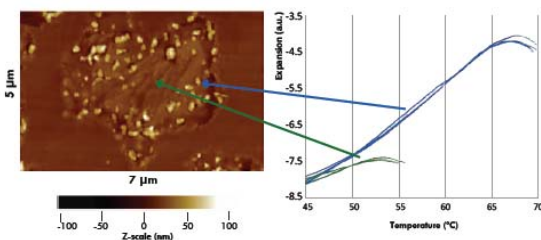


VESTA システムに原子間力顕微鏡 (AFM) が内蔵され、更に局所の熱分析、マッピングが可能になり、ナノスケール赤外分光分析機能のアップグレードも出来る装置です。



【基本システム】 AFMプラス熱分析

● 局所熱分析 (Nano-TA)



AFM 高さ像

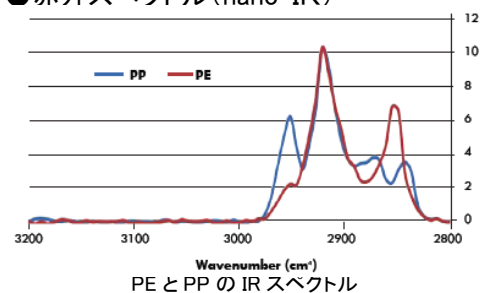
ローカル熱分析

● 転移温度マッピング (TTM)

● 表面熱伝導性/温度マッピング (SThM)

【アップグレード】 プラスIRスペクトロスコピー

● 赤外スペクトル (nano-IR)



PE と PP の IR スペクトル

● IR 吸収マッピング

● 表面硬さイメージ

詳細は下記にお問い合わせ下さい。

㈱日本サーマル・コンサルティング

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-5-11 新宿三葉ビル 5F
PH03-5339-1470 Fax03-5339-1471

Email : info@thermconsult.co.jp
Web : www.therm-info.com